

| Номер п/п | Наименование квалификации | Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации | Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом | Положения профессионального стандарта | | | Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта | Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Срок действия свидетельства о квалификации | Дополнительные характеристики и (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории и должности/класса профессии |
|-----------|---|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | | код трудовой функции | наименование трудовой функции | дополнительные сведения (при необходимости) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Инженер-технолог по контролю качества производства и наногетероструктурных сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем (7 уровень квалификации) | Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «03» февраля 2014 г. №69н | 7 | В/03.7 | Разработка методики входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктурных сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем | – | – | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета и магистратуры. по одному из направлений: «Электроника и микроэлектроника»; «Электроника и нанoeлектроника»; «Нанотехнологии и м | 5 лет | – |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|---|--|--|--|--|---|
| | | | | В/06.7 | Организация работы по повышению выхода годных монокристаллических интегральных схем, разработка технического задания для корректировок и технологических операций | | | | | микросистемная техника»; «Физическая электроника» ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже специалитета и магистратуры 2. Документ о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации |
| | | | | С/03.7 | Определение методик тестирования качества эпитаксиальных слоев | | | | | |
| | | | | С/04.7 | Проведение статистического анализа поведения установки во время исследования, статистическое сопровождение по группам продукции и контроль качества по спецификации заказчика | | | | | |